

第2回 分析技術分科会

研修会

このたび、分析技術分科会では、当センターが保有している電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)を利用した工業材料等の表面観察や元素分析に関する研修会を下記のとおり開催いたしますので、御案内申し上げます。

是非とも本研修会を通じて分析技術への御理解を深めていただき、今後さらに、当センターを積極的に御利用いただければ幸いです。

御多忙中とは存じますが、皆様の御参加をお待ちしております。

開催日時・場所

■開催日時

平成30年2月 23日(金) 13:30~17:00

■開催場所

宮崎県工業技術センター

場所: 中研修室ほか

(〒880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂16500-2)

電話(0985)74-4311 FAX(0985)74-4488

内容

■ 13:00~ 【受付開始】

■ 13:30~ 【開会】

■ 13:35~15:05 【座学】「SEMの原理と観察テクニック/SEM試料前処理の基礎」

講師 株式会社日立ハイテクノロジーズ アプリケーション開発部 坂上 万里 氏

■ 15:25~16:55 【実習】「SEMの操作」

講師 同上

■ 17:00 【閉会】

■電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)の概要

電子ビームで試料表面を走査し、試料から生じる二次電子や反射電子等の情報を検出することで、試料表面の拡大像を画面上に表示する装置です。光学顕微鏡に比べ、幅広い倍率での観察が可能であり、焦点深度が深く、立体的な画像が得られるため、試料表面の微細構造を観察する際に有効です。

また、付属のエネルギー分散型X線分析装置(EDX)と併用することで、微小領域の簡易的な元素分析にも御活用いただけます。



■機器の仕様

FE-SEM

【メーカー】株式会社日立ハイテクノロジーズ

【型式】S-4800

【倍率】×20~×800,000

【試料室雰囲気】真空

【最大試料サイズ】100mm径×29mm高

EDX

【メーカー】アメテック株式会社

【型式】EDAX Genesis APEX2

【検出元素範囲】Be~Am

【検出素子面積】40mm²

【冷却方式】電子冷却

お申込み

下記に必要事項を御記入の上、FAX又は電子メールにてお申し込みください。

企業団体名			
TEL/FAX			
E-mail			
役職	氏名	座学	実習

参加費
無料

◆申込期限◆
2月9日(金)

<お申込み先>

FAX: 0985-74-4488

E-mail:

yuasa-tomonori@pref.miyazaki.lg.jp

※御希望を○×で御記入ください。

(ただし、実習につきましては、1機関1名様限りとさせていただきます。予め御了承ください。)

定員

下記の定員になり次第、申込みを締め切らせていただきます。

■座学: 40名

■実習: 10名

お問合せ

宮崎県工業技術センター 材料開発部 担当: 湯浅

TEL: 0985-74-4311